

# 1119.走査型プローブ顕微鏡



装置設備名称	走査型プローブ顕微鏡
メーカー	S II
商品名・型式	SPA400
性能・仕様	カンチレバーを交換することにより原子間力顕微鏡 (AFM)測定、ダイナミックフォースモード(DFM)測定ができます。 走査エリア/形状：100nm～20μm/1μm以下の凸凹
設備概要・用途	先端が数nmの細く尖った探針で試料表面を走査することで、高倍率な立体形状観察と物性分析を行う顕微鏡です。
対象試料	固体
その他・注意事項	